

QIII SM™

表面粒子計測器

0.3-10um

生産性の再定義

ペンタゴン テクノロジーの表面粒子計測器シリーズは、ハイテク産業における表面汚染の測定および管理の標準となっています。重要な製品の表面にパーティクルが蓄積すると、歩留まりや信頼性が低下する恐れがあります。

パーティクルに敏感な製造工程において最適なパフォーマンスを実現するには、表面汚染の定量化された指標を取得することが重要です。QIII Surface Metric - QIII SM は、先進的なインターフェイス(特許取得済み)を使用して、粒子を表面から再浮遊させ検出します。**QIII SM を使用することで、貴社の時間、費用コストとなるパーティクルを発見し、排除できます。**

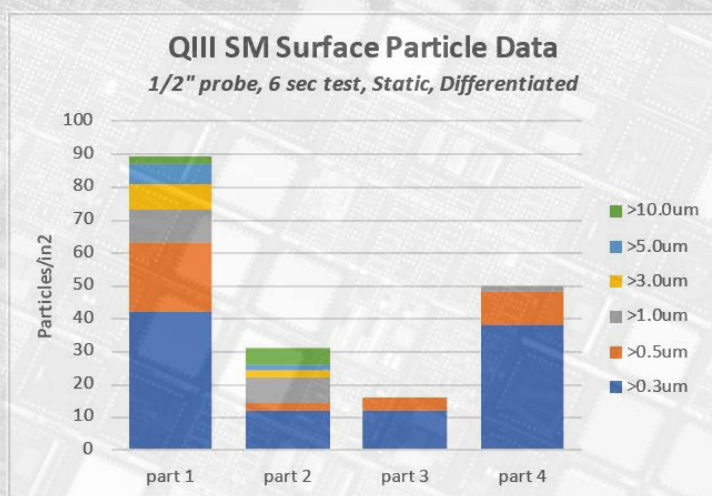


QIII SM, 2 inch probe

特徴

- 表面微粒子を瞬時に測定
- 表面パーティクルを減らすことによる歩留まり向上
- パーティクル発生源を瞬時に特定、トラブルシューティング時間を短縮
- 入出荷商品のパーティクル付着状態の管理
- 表面パーティクルの管理基準を確立し、継続的な改善を推進
- ISO 14644-9に準拠した表面清浄度の検証
- SPC (統計的工程管理)システムへのデータ統合
- BKM モードオプション-測定と仕様の一貫化
- 計測に対応した豊富なプローブをラインナップ
- 21 CFR Part 11 ライフサイエンスアプリケーションに適合

SAMPLE DATA:



QIII SM™ SIDE VIEW



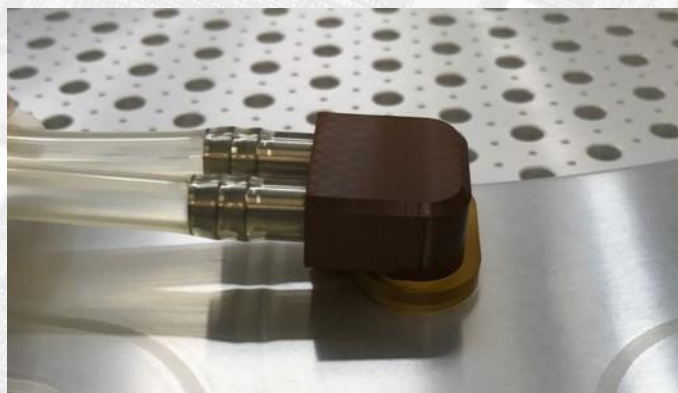
Batteries and USB Port



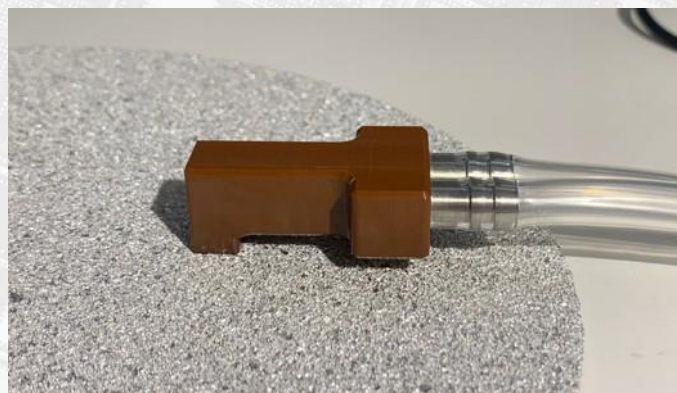
QIII SM、1/2 inch probe

仕様

- 粒子感度範囲: 0.3um -10um
- チャンネル: 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um
- センサー: レーザーダイオード
- サイズと重量: 幅305mm x 奥行き267mm x 高さ229mm、8.4kg
- バッテリー: (2) リチウムイオン、ホットスワップ可能
- ディスプレイ: 7 インチ WVGA、密閉型タッチ スクリーン インターフェイス (拡大縮小機能付き)
- データ単位: パーティクル密度および Raw カウント
- 表面粒子測定を平均化するためのデータ分析モードを備えた高度なユーザー インターフェイス
- データ出力: USB ポート、イーサネット、WiFiオプション
- 付属のプローブ: 1/2 インチ直角プローブ
- 同梱パージ用オプション: 検出器をゼロカウントするパージフィルターと、プローブをゼロ カウントするプローブパージ機能
- 空気流量を 50% 増加させたセルフクリーニングモード
- 入力電源: 100-240 VAC、50/60 Hz
- サンプルングモード: 静的(スタティック)および動的(ダイナミック)
- CE認証済み
- 対応言語: 英語、中国語、日本語、韓国語
- 製造国: 米国



治具付きのハーフインチプローブの例



高粗度表面向けFin typeプローブの例

オプション

標準プローブ: 平らな表面、筒、ガス配管、容器、または洗浄が難しいエッジの内部を測定するための多様なプローブをラインナップ

特注プローブ: 各種表面に適合する特注プローブの設計

粒子分析モジュールプローブ: 分析目的でのパーティクル捕集

BKM モード: 最もよく知られている方法で、測定点、仕様で、テスト対象表面をイメージしてキャプチャ

ロボットセル: In-situ(現場)測定のためのリモート接続機能

バッテリー充電器: 充電用の追加バッテリーセット